

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃～60℃(注2)			
	電圧		AC 125V			使用湿度範囲		40%～80%			
	電流		0.5A			保存湿度範囲		40%～70%(注2)			
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
電気的 性能	接触抵抗	100mA(DC又は1000Hz)で測定する。				45mΩ以下				○	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20mV以下、1mA(DCまたは1000Hz)で 測定する。				55mΩ以下				○	—
	絶縁抵抗	DC 250Vで測定する。				100MΩ以上				○	—
	耐電圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—
機械的 性能	繰り返し動作	500回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 55mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐振性	周波数 10～55Hz、全振幅 1.52mm、 3方向各 2時間試験する。				① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐衝撃性	加速度 490m/s ² 、持続時間 11ms、 正弦半波 3方向各 3回試験する。								○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96時間放置する。				① 接触抵抗: 55mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100MΩ以上				○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10→15→30→10→15分 を 5サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	塩水噴霧	濃度 5%の塩水、48時間放置する。				① 接触抵抗: 55mΩ以下				○	—
	硫化水素	濃度 3ppm、96時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。				○	—
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間				外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。				○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5秒以内								○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 2秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。				○	—
備考											
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。						製図		担当		検図	
						04.02.17 鈴木		04.2.17 中村		04.2.18 山口	
						承認		承認		出図	
						04.2.18 大川					
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
製品規格表											
製品名						FX2-**P-1.27DSL(71)					
旧CL						製品コード					
CL						CL572					
図番						1					
SLC4-083294-21						1					